

001**ANÁLISE PELO MÉTODO DE ABELÈS COM EXTENSÃO DE HACSKAYLO PARA FILMES ÓPTICOS PRODUZIDOS PELO MÉTODO DE ÍON EXCHANGE.** *Marcelo Barbalho Pereira, Flávio Horowitz.* (Laboratório de Óptica de Filmes Finos, Grupo Laser, UFRGS).

O controle do valor das constantes ópticas se constitui em fator essencial, quando das aplicações de filmes finos ópticos. Além disso, o conhecimento das limitações das técnicas de caracterização, nos assegura sua confiabilidade. Utilizamos como amostra um filme dopado com sais de prata sobre um substrato de vidro BK-7, previamente recoberto com um filme de alumínio em metade de uma de suas faces, produzido pelo método de ion exchange no Instituto de Física da UNICAMP. Após a retirada da máscara de alumínio, através do método de Abelès, obtemos para o índice de refração na interface filme-ar o valor de 1.54 ± 0.03 . Com a extensão de Hacskaylo, obtemos 1.526 ± 0.004 , com o aumento de precisão de uma ordem de grandeza. Estes resultados permitem que, ao adaptar modelos para o perfil de índice do filme, fica fornecido experimentalmente o valor do índice para a interface filme-ar. Este procedimento pode ser estendido a filmes com perfil de índice variável constituídos de outros materiais. (CNPq).